

共催：千葉大学千葉ヨウ素資源イノベーションセンター(CIRIC)、千葉大学共用機器センター(CAI)
日本電子株式会社(JEOL)
協賛：ヨウ素学会

CIRIC-CAI-JEOL 分析機器講習会

「走査電子顕微鏡の 基礎と応用」

研究開発の強力なツールである走査電子顕微鏡(SEM)について、装置の説明、観察前の試料処理、観察例等を日本電子(株)の担当者から説明いたします。対象は、電子顕微鏡をこれから使ってみようとする方、使い始めて間もない方で、企業の皆さん、学生の皆さん、どなたでも参加いただけます。午後の質疑応答コーナーでは、不明点や疑問点も解決できます。

開催日：令和4年5月12日(木) 10:00~16:30

場所：千葉大学 千葉ヨウ素資源イノベーションセンター 1階講義室

講師：日本電子株式会社 SI 営業本部 SI 販促室 川内 一晃 様

[午前]

10:00-10:10 開会挨拶 (共用機器センター 副センター長 榎 飛雄真 准教授)

10:10-12:00 SEM を中心とした電子顕微鏡の基礎
・走査型電子顕微鏡の基礎 ・EDS の基礎

[午後]

13:00-14:50 生物系、材料系の測定例と最新情報の紹介
・材料系試料の測定例: サンプルングを中心として
・クロスセクションポリッシャーの紹介
・生物系試料の測定例: 試料前処理方法
・質疑応答

14:50-15:00 閉会挨拶

[見学会]

15:00-16:30 電子顕微鏡見学

受講料
無料

定員：各先着 30 人 ※午前のみ・午後のみ・見学会のみの受講も可能です。

申込方法：右のQRコード、または下のリンクからお申し込みください。

<https://forms.gle/RScXSNfwkkn12yYL8>



問い合わせ先：千葉大学 千葉ヨウ素資源イノベーションセンター(CIRIC) 事務室

E-mail: ciric-network@chiba-u.jp TEL: 043-290-2883